Definicja przestrzeni probabilistycznej

Rozkładem prawdopodobieństwa Pw pewnym zbiorze zdarzeń elementarnych $\Omega \neq \emptyset$ nazywamy odwzorowanie

$$P: \Sigma \mapsto [0;1]$$
,

gdzie Σ jest rodziną podzbiorów Ω (inaczej rodziną zdarzeń) taką, że

$$\Omega \in \Sigma$$
, $A \in \Sigma \implies A' \in \Sigma$, $\forall A_1, A_2, \ldots \in \Sigma : \bigcup_i A_i \in \Sigma$,

które spełnia: $P(\Omega)=1$ oraz dla dowolnych parami rozłącznych zdarzeń $A_1,A_2,\ldots\in\Sigma$ zachodzi

$$P\left(\bigcup_{i} A_{i}\right) = \sum_{i} P(A_{i}).$$

Trójkę (Ω, Σ, P) nazywamy przestrzenią probabilistyczną. Z powyższej definicji wynikają znane własności prawdopodobieństwa tj. P(A') = 1 - P(A) oraz $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A, B)$.

Prawdopodobieństwo warunkowe

Definiujemy również prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem zdarzenia B o dodatnim prawdopodobieństwie

$$P(A \mid B) := \frac{P(A, B)}{P(B)}.$$

Na podstawie powyższej definicji definiujemy niezależność zdarzeń A,B jako własność P(A,B)=P(A)P(B), co dla zdarzenia B o dodatnim prawdopodobieństwie jest równoważne z $P(A\mid B)=P(A).$ Ponadto jeśli zdarzenia $A_1,A_2,\ldots\in\Sigma$ są parami rozłączne i zachodzi $\bigcup_i A_i=\Omega$ to dla dowolnego zdarzenia $B\in\Sigma$ możemy zapisać

$$P(B) = \sum_{i} P(B \mid A_i) P(A_i).$$

Z definicji prawdopodobieństwa warunkowego trywialnie udowodnić twierdzenie Bayesa

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}.$$

Zmienne losowe

W uczeniu maszynowym będą interesować nas zmienne o wartościach w \mathbb{R}^n . Zmienne takie nazywamy zmiennymi losowymi wielowymiarowymi i definiujemy jako odwzorowania

$$X: \Omega \mapsto \mathbb{R}^n$$

takie, że dla każdego $A \subseteq \mathbb{R}^n$ zbiór $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$ należy do rodziny zdarzeń Σ . Przy takiej definicji prawdopodobieństwo, iż zmienna X ma wartość należaca do pewnego przedziału A wynosi

$$P(X \in A) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}).$$

Dowolny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej n-wymiarowej $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ jest wyznaczony jednoznacznie przez zadanie funkcji $F(\mathbf{x})$: $\mathbb{R}^n \mapsto [0; 1]$ zwanej dystrybuantą zdefiniowanej jako

$$F(\mathbf{x}) = F(x_1, \dots, x_n) := P(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n)$$
.

Zasadniczo będą nas interesować jednak dwa przypadki rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych: rozkłady dyskretne i rozkłady ciągłe. W przypadku rozkładu dyskretnego istnieje pewien przeliczalny zbiór $S \subset \mathbb{R}^n$ taki, że $P(X \in S) = 1$. Rozkład ten jest zadany jednoznacznie przez podanie |S| liczb $p_i > 0$ określających prawdopodobieństwa $p_i = P(X = \mathbf{x}_i)$ dla wszystkich $\mathbf{x}_i \in S$. W przypadku rozkładu ciągłego istnieje z kolei funkcja $p(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \mapsto [0; \infty)$ taka, że

$$P(X_1 \in [a_1; b_1], \dots, X_n \in [a_n; b_n]) = \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}$$
.

Funkcje $p(\mathbf{x})$ nazywamy gęstością prawdopodobieństwa. W obu przypadkach musi być spełniony warunek unormowania postaci odpowiednio

$$\sum_{i} p_{i} = 1, \quad \int_{\mathbb{D}_{n}} p(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}^{n} \mathbf{x} = 1.$$

Będziemy często wykorzystywać wartość oczekiwaną pewnej funkcji $f(\mathbf{x})$ zmiennej losowej X zdefiniowaną odpowiednio dla rozkładu p – dyskretnego lub ciągłego jako

$$\mathbb{E}[f(\mathbf{x})] := \sum_{\mathbf{x}_i \in S} f(\mathbf{x}_i) p_i \cong \int_{\mathbb{P}^n} f(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x} .$$

Zauważmy przy tym, iż funkcja $f(\mathbf{x})$ może być zupełnie dowolna, np. dla funkcji charakterystycznej (indykatorowej) zbioru $A \subset \mathbb{R}^n$ $f(\mathbf{x}) = \mathcal{I}_A$ mamy $\mathbb{E}[\mathcal{I}_A(\mathbf{x})] = P(X \in A)$ lub dla iloczynu funkcji Heaviside'a $f(\mathbf{x}) = \theta(t_1 - x_1) \cdots \theta(t_n - x_n)$ mamy $\mathbb{E}[f(\mathbf{x})] = F(t_1, \dots, t_n)$.

Rozkłady brzegowe

Niech $X=(X_1,\ldots,X_n)$ będzie n-wymiarową zmienną losową o dystrybuancie $F(\mathbf{x})$. Rozkład brzegowy względem k zmiennych $X_{\sigma(1)},\ldots,X_{\sigma(k)}$ definiujemy jako rozkład wyznaczony przez dystrybuantę

$$F_{X_{\sigma(1)},\dots,X_{\sigma(k)}}(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(k)}) := \lim_{\substack{x_{\sigma(k+1)}\to\infty,\dots,x_{\sigma(n)}\to\infty}} F(x_1,\dots,x_n).$$

Zmienne losowe niezależne

Niech $X=(X_1,\ldots,X_k)$ będzie n-wymiarową zmienną losową o rozkładzie wyznaczonym przez dystrybuantę $F(\mathbf{x})$. Powiemy, iż zmienne losowe n_1,\ldots,n_k - wymiarowych $(n_1+\ldots+n_k=n)$ X_1,\ldots,X_k są niezależne iff dla dowolnych $\mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^{n_1},\ldots,\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^{n_k}$ zachodzi

$$F(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_k) = F_{X_1}(\mathbf{x}_1)\cdot\ldots\cdot F_{X_k}(\mathbf{x}_k)$$
.

Rozkłady warunkowe

W ogólnym przypadku zmiennej losowej n – wymiarowej $Z=(Z_1,\ldots,Z_n)$ o ciągłym rozkładzie $p(\mathbf{z})$ jeśli wydzielimy zmienne k i n-k – wymiarowe $X=(Z_{\sigma(1)},\ldots,Z_{\sigma(k)}),\ Y=(Z_{\sigma(k+1)},\ldots,Z_{\sigma(n)})$ to rozkład warunkowy zmiennej $X\mid Y$ definiujemy jako rozkład zadany przez gęstość prawdopodobieństwa

$$p(\mathbf{x} \mid \mathbf{y}) := \frac{p(\mathbf{z})}{p_Y(\mathbf{y})} = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p_Y(\mathbf{y})}.$$

Transformacja zmiennych wielowymiarowych

Niech $X=(X_1,\ldots,X_n)$ będzie zmienną losową wielowymiarową o rozkładzie ciągłym o gęstości $p_X(\mathbf{x})$. Rozważmy bijekcję $(X_1,\ldots,X_n)\mapsto (Y_1,\ldots,Y_n)$. Chcemy znaleźć wyrażenie na gęstość $p_Y(\mathbf{y})$ w nowych zmiennych. Ponieważ infinitezymalne prawdopodobieństwo jest niezmiennicze względem zmiany współrzędnych więc zachodzi

$$p_X(x_1,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}x_1\ldots\mathrm{d}x_n=p_Y(y_1,\ldots,y_n)\,\mathrm{d}y_1\ldots\mathrm{d}y_n$$

skąd

$$p_Y(y_1,\ldots,y_n) = \left| \frac{\partial(x_1,\ldots,x_n)}{\partial(y_1,\ldots,y_n)} \right| p_X(x_1(\mathbf{y}),\ldots,x_n(\mathbf{y})).$$

Macierz kowariancji

Macierz kowariancji funkcji $f(\mathbf{x})$ zmiennej losowej X definiujemy jako

$$\mathbf{\Sigma}[f(\mathbf{x})] := \mathbb{E}\left[(f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\mu}_f)(f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\mu}_f)^\top\right] \,,$$

gdzie $\boldsymbol{\mu}_f = \mathbb{E}[f(\mathbf{x})]$. Elementy diagonalne $\boldsymbol{\Sigma}_{ii}$ tej macierzy nazywamy wariancjami zmiennych X_i , natomiast elementy pozadiagonalne $\boldsymbol{\Sigma}_{ij}$ nazywamy kowariancjami zmiennych X_i i X_j . Oczywiście $\boldsymbol{\Sigma}$ jest macierzą symetryczną. Nadto jeśli f jest funkcją identycznościową tj. $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ to $\boldsymbol{\Sigma}$ jest macierzą nieujemnie określoną, gdyż dla dowolnego $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ mamy

$$\mathbf{v}^{\top} \mathbf{\Sigma} \mathbf{v} = \mathbb{E}[\mathbf{v}^{\top} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^{\top} \mathbf{v}] = \mathbb{E}[z^2] \geq 0,$$

gdzie $z = \mathbf{v}^{\top}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \in \mathbb{R}$. Jeśli X_1, \dots, X_n są niezależne i f jest funkcją identycznościową to Σ jest macierzą diagonalną.

Wielowymiarowy rozkład normalny

Jeśli zmienna wielowymiarowa $X=(X_1,\ldots,X_n)$ ma wielowymiarowy rozkład normalny (z ang. Multivariate Normal distribution – MVN) z wartością oczekiwaną μ i macierzą kowariancji Σ , co oznaczamy jako $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, to gęstość prawdopodobieństwa jest dana

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \mathbf{\Sigma}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \mathbf{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}$$

Macierz $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{\Sigma}^{-1}$ nazywamy macierzą precyzji. Jeśli \mathbf{v}_i są unormowanymi wektorami własnymi macierzy $\mathbf{\Sigma}$, a λ_i odpowiadającymi im wartościami własnymi i zakładając, iż widmo $\{\lambda_i\}$ jest niezdegenerowane mamy z twierdzenia spektralnego

$$oldsymbol{\Lambda} = \sum_{i=1}^n rac{1}{\lambda_i} \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^{ op}$$

oraz wiemy, iż wektory $\{\mathbf{v}_i\}$ tworzą bazę ortonormalną przestrzeni \mathbb{R}^n . Z powyższego możemy zatem wyrazić wektor $\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$ jako kombinację liniową wektorów $\{\mathbf{v}_i\}$ tj.

$$\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^n t_i \mathbf{v}_i \,,$$

co pozwala zapisać gestość prawdopodobieństwa jako

$$\phi(t_1,\ldots,t_2) \cong \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \frac{t_i^2}{\lambda_i}\right\}.$$

Z powyższego wzoru widać, iż poziomice gęstości są wielowymiarowymi elipsoidami, których półosie są skierowane wzdłuż wektorów własnych Σ i mają długości proporcjonalne do $\sqrt{\lambda_i}$.

Powiemy, iż wielowymiarowa zmienna losowa $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ ma standardowy wielowymiarowy rozkład normalny jeśli $\mu = 0$ i $\Sigma = 1$. Wówczas

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{x}\right\}.$$

Można wykazać, iż jeśli $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ dla Σ o niezdegenerowanym widmie to wszystkie rozkłady brzegowe i warunkowe X są rozkładami normalnymi.

Zbieżność w rachunku prawdopodobieństwa

W rachunku prawdopodobieństwa definiujemy trzy zasadnicze rodzaje zbieżności ciągu zmiennych losowych (X_n) .

• Ciąg (X_n) jest zbieżny do X stochastycznie iff

$$\forall \epsilon > 0 : \lim_{n \to \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1.$$

• Ciąg (X_n) jest zbieżny do X z prawdopodobieństwem 1 iff

$$P\left(\lim_{n\to\infty}X_n=X\right)=1.$$

• Ciąg (X_n) n-wymiarowych zmiennych losowych jest zbieżny do X według dystrybuant iff

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, F_X(\mathbf{x})$$
 – ciągła w $\mathbf{x} : \lim_{n \to \infty} F_{X_n}(\mathbf{x}) = F_X(\mathbf{x})$

Pomiędzy tak zdefiniowanymi rodzajami zbieżności zachodzą następujące implikacje:

- 1. $X_n \to X$ z prawdopodobieństwem 1 $\implies X_n \to X$ stochastycznie
- 2. $X_n \to X$ stochastycznie $\implies X_n \to X$ według dystrybuant
- 3. $X_n \to X$ stochastycznie \implies istnieje podciąg (X_{n_k}) zbieżny do X z prawdopodobieństwem 1

Wnioskowanie statystyczne

Modelem statystycznym nazwiemy parę (χ, \mathcal{P}) , gdzie \mathcal{P} jest rodziną rozkładów prawdopodobieństwa w zbiorze χ , przy czym będziemy zakładać $\chi = \mathbb{R}^n$

$$\mathcal{P} := \{ p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta \} ,$$

gdzie Θ jest zbiorem parametrów modelu \mathcal{P} . Prostą próbą losową w modelu \mathcal{P} nazwiemy ciąg niezależnych zmiennych losowych X_1,\ldots,X_n o wartościach w \mathbb{R}^n i pochodzących z tego samego rozkładu $p(\mathbf{x}\mid\theta)\in\mathcal{P}$ (w angielskiej terminologii taki ciąg zmiennych losowych nazwiemy i.i.d. tj. independent and identically distributed). Statystyką z kolei nazwiemy zmienną losową T będącą funkcją prostej próby losowej tj. $T=T(X_1,\ldots,X_n)$. Być może najważniejszym przykładem statystyki jest średnia oznaczana jako \overline{X}

$$\overline{X}(X_1,\ldots,X_n) := \frac{X_1+\ldots+X_n}{n}$$
.

Wartość oczekiwana statystyki średniej $\overline{X}(X_1,\ldots,X_n)$ dla X_i z rozkładu $X\sim\mathcal{D}$ o gęstości p wynosi

$$\mathbb{E}[\overline{X}] = \int \cdots \int \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) p(X_1) \cdots p(X_n) \, dX_1 \dots dX_n = \mathbb{E}[X].$$

Wariancja statystyki średniej wynosi z kolei

$$\operatorname{Var}[\overline{X}] = \mathbb{E}[\overline{X}^{2}] - \mathbb{E}[\overline{X}]^{2}$$

$$= \int \cdots \int \frac{1}{n^{2}} \left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} + \sum_{i \neq j} X_{i} X_{j} \right) p(X_{1}) \cdots p(X_{n}) dX_{1} \dots dX_{n} - \mathbb{E}[X]^{2}$$

$$= \frac{1}{n} \mathbb{E}[X^{2}] + \frac{n(n-1)}{n^{2}} \mathbb{E}[X]^{2} - \mathbb{E}[X]^{2} = \frac{1}{n} \left[\mathbb{E}[X^{2}] - \mathbb{E}[X]^{2} \right] = \frac{1}{n} \operatorname{Var}[X].$$

Silne prawo wielkich liczb

Niech (X_n) będzie ciągiem zmiennych losowych i.i.d. z pewnego rozkładu $X \sim \mathcal{D}$. Przez (\overline{X}_n) oznaczmy ciąg średnich częściowych tj.

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Wówczas zachodzi silne prawo wielkich liczb

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\overline{X}_n=\mathbb{E}[X]\right)=1\,,$$

czyli średnia próbek zbiega do wartości oczekiwanej z prawdopodobieństwem 1.

Silne prawo wielkich liczb daje nam potężne narzędzie do szacowania wartości oczekiwanych, gdyż możemy je przybliżać średnią z dużej liczby próbek losowych, a dokładność tego przybliżenia zależy jedynie od liczby próbek i wariancji X. Jeśli X jest zmienną wielowymiarową to dokładność przybliżenia nie zależy wprost od liczby wymiarów i unikamy tzw. $curse\ of\ dimensionality$.

Centralne Twierdzenie Graniczne

Niech (X_n) będzie ciągiem k-wymiarowych zmiennych losowych i.i.d. z dowolnego rozkładu $X \sim \mathcal{D}$ o wartości oczekiwanej $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{x}]$ i odwracalnej macierzy kowariancji $\boldsymbol{\Sigma}$. Oznaczając przez (\overline{X}_n) ciąg średnich częściowych ciągu (X_n) zachodzi

$$\sqrt{n}\left(\overline{X}_n - \boldsymbol{\mu}\right) \to Z \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\Sigma})$$
.

Oznacza to, iż dla ciągu X_1,\ldots,X_n zmiennych losowych i.i.d. z praktycznie dowolnego rozkładu $X\sim\mathcal{D}$ dla odpowiednio dużych n średnią z próbek możemy traktować jako zmienną losową o rozkładzie normalnym $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu},n^{-1/2}\boldsymbol{\Sigma})$.

Estymatory punktowe MLE i MAP

Rozważamy model statystyczny $\mathcal{P} = \{p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta\}$. Estymatorem parametru θ nazwiemy statystykę $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ służącą do oszacowania wartości tego

parametru. Wartość tej statystki dla konkretnej realizacji prostej próby losowej $\hat{\theta}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ nazwiemy estymatą parametru θ . Dodatkowo definiujemy obciążenie (z ang. bias) estymatora jako wielkość

$$\mathbb{B}[\hat{\theta}] := \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta.$$

Zasadniczo będą nas interesować dwa rodzaje estymat: MLE i MAP. W przypadku estymaty MLE (z ang. Maximum Likelihood Estimate) definiujemy funkcję wiarygodności (likelihood) dla modelu $\mathcal{P} = \{p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta\}$ i realizacji prostej próby losowej (którą nazwiemy również danymi lub obserwacjami) $D = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ jako

$$p(D \mid \theta) = \prod_{i=1}^{n} p(\mathbf{x}_i \mid \theta).$$

Estymatą MLE nazywamy taką wartość parametru $\theta_{\text{MLE}} \in \Theta$, że

$$p(D \mid \theta_{\text{MLE}}) = \max_{\theta \in \Theta} p(D \mid \theta).$$

Ponieważ znajdywanie maksimum funkcji będącej iloczynem nie jest zadaniem przyjemnym (chociażby obliczanie pochodnych iloczynu funkcji jest trudniejsze od sumy), więc wprowadzamy zanegowaną logarytmiczną funkcję wiarygodności

$$\ell(D \mid \theta) = -\log p(D \mid \theta) = -\sum_{i=1}^{n} \log p(\mathbf{x}_i \mid \theta),$$

wówczas ze względu na fakt, iż funkcja $\log x$ jest ściśle rosnąca estymatę MLE możemy równoważnie wyznaczyć jako

$$\ell(D \mid \theta_{\mathrm{MLE}}) = \min_{\theta \in \Theta} \ell(D \mid \theta).$$

Funkcję ℓ będziemy również nazywać funkcją kosztu.

W przypadku estymaty MAP (z ang. *Maximum a posteriori estimate*) wprowadzamy gęstość rozkładu a posteriori jako

$$p(\theta \mid D) = \frac{1}{Z}p(D \mid \theta)\pi(\theta),$$

gdzie Z jest stałą wynikającą z warunku unormowania, a $\pi(\theta)$ to gestość prawdopodobieństwa opisująca rozkład a priori parametru θ . Estymatą MAP nazywamy taką wartość parametru $\theta_{\text{MAP}} \in \Theta$, że

$$p(\theta_{\text{MAP}} \mid D) = \max_{\theta \in \Theta} p(\theta \mid D).$$

Zauważmy przy tym iż liczba Znie jest nam potrzebna, gdyż wystarczy zmaksymalizować licznik tj.

$$\theta_{\text{MAP}} = \arg \max_{\theta \in \Theta} p(D \mid \theta) \pi(\theta).$$

Wnioskowanie Bayesowskie

Zajmiemy się teraz wnioskowaniem opartym na twierdzeniu Bayesa. Rozpatrujemy model statystyczny $\mathcal{P} = \{p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta\}$. Załóżmy, iż mamy obserwacje $D = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$, wówczas twierdzenie Bayesa możemy zapisać jako

$$p(\theta \mid D) = \frac{p(D \mid \theta)\pi(\theta)}{p_D(D)} = \frac{p(D \mid \theta)\pi(\theta)}{\int p(D \mid \theta)\pi(\theta) d\theta},$$

gdzie $p(\theta \mid D)$ nazywamy rozkładem a posteriori (posteriorem), $p(D \mid \theta)$ – wiarygodnością (likelihood), a $\pi(\theta)$ – rozkładem a priori (priorem).

Całe wnioskowanie Bayesowskie opiera się na wyznaczeniu rozkładu a posteriori, który wyraża całą naszą wiedzę o estymowanym parametrze θ . Na podstawie tego rozkładu możemy wyznaczyć estymatę punktową MAP, jak również niepewność związaną z wyznaczeniem tej estymaty np. poprzez wyznaczenie przedziału wiarygodności $C_{1-\alpha}(\theta \mid D) = [\theta_l; \theta_u]$ takiego, że

$$P(\theta \in [\theta_l; \theta_u] \mid D) = 1 - \alpha,$$

dla ustalonego $0 < \alpha < 1$. Możemy również skonstruować rozkład predykcyjny (z ang. posterior predictive distribution) określający prawdopodobieństwo zaobserwowania nowej obserwacji ${\bf x}$

$$p(\mathbf{x} \mid D) = \int_{\Theta} p(\mathbf{x} \mid \theta) p(\theta \mid D) d\theta$$
.

Modele Gaussowskie

Jak już wspomnieliśmy w przypadku gdy zmienna losowa ma wielowymiarowy rozkład normalny $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ wszystkie rozkłady brzegowe i warunkowe są również rozkładami normalnymi. W szczególnym przypadku gdy zmienne k i n-k- wymiarowe \mathbf{x} i \mathbf{y} mają łącznie rozkład normalny

$$egin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(oldsymbol{\mu}, oldsymbol{\Sigma}) \, ,$$

gdzie

$$oldsymbol{\mu} = egin{bmatrix} oldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} \\ oldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}} \end{bmatrix}, \quad oldsymbol{\Sigma} = egin{bmatrix} oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xx}} & oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xy}} \\ oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yx}} & oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}} \end{bmatrix}$$

można pokazać iż

$$\mathbf{x} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}) \,, \quad \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y} \mathbf{y}}) \,,$$

gdzie

$$egin{aligned} m{\mu}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} &= m{\mu}_{\mathbf{x}} + m{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{y}} m{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y} - m{\mu}_{\mathbf{y}}) \ m{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} &= m{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{x}} - m{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{y}} m{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{x}}^{-1} m{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Liniowe modele Gaussowskie

Powyższe własności rozkładów łącznych pozwalają jawnie wnioskować w tzw. liniowych modelach Gaussowskich (z ang. Linear Gaussian Models). Załóżmy, iż nasze obserwacje są modelowane przez n-wymiarową zmienną losową \mathbf{y} o rozkładzie normalnym z estymowanym parametrem \mathbf{x} i znanymi parametrami \mathbf{A} , \mathbf{b} , $\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}}$ tak, że wiarygodność ma postać

$$\mathbf{y} \mid \mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{v}})$$

gdzie **A** jest macierzą wymiaru $n \times k$. Jako prior na parametr **x** przyjmiemy również rozkład normalny o pewnych zadanych parametrach $\mu_{\mathbf{x}}$, $\Sigma_{\mathbf{x}}$ (taki wybór rozkładu a priori nazywamy rozkładem sprzężonym do wiarygodności)

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}})$$
.

Wówczas łatwo pokazać, iż rozkład a posteriori jest rozkładem normalnym

$$\mathbf{x} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}})$$

z parametrami

$$\begin{split} & \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \left[\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} + \mathbf{A}^{\top}\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1}\mathbf{A}\right]^{-1} \\ & \mu_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} \left[\mathbf{A}^{\top}\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b}) + \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1}\mu_{\mathbf{x}}\right] \end{split}$$

Załóżmy teraz, iż mamy ciąg obserwacji $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_m)$. Wnioskowanie Bayesowskie możemy wówczas stosować iteracyjnie tzn. na początku dla 0 obserwacji rozkład estymowanego parametru jest opisany przez prior $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0)$. Po zaobserwowaniu jednego \mathbf{y}_1 aktualizujemy nasze przekonania co do parametru \mathbf{x} zgodnie z powyższym wzorem i otrzymujemy rozkład normalny o parametrach

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Sigma}_1 = \left[\boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} + \boldsymbol{\mathsf{A}}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \boldsymbol{\mathsf{A}} \right]^{-1} \\ & \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\Sigma}_1 \left[\boldsymbol{\mathsf{A}}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}_1 - \mathbf{b}) + \boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} \boldsymbol{\mu}_0 \right] \end{split} .$$

Po zaobserwowaniu kolejnego \mathbf{y}_2 ponownie wykorzystujemy powyższe wzory ale jako prior wykorzystując rozkład w poprzedniej iteracji. W ogólności możemy zapisać wzór rekurencyjny na m+1 rozkład jako

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Sigma}_{m+1} = \left[\boldsymbol{\Sigma}_m^{-1} + \boldsymbol{\mathsf{A}}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \boldsymbol{\mathsf{A}} \right]^{-1} \\ & \boldsymbol{\mu}_{m+1} = \boldsymbol{\Sigma}_{m+1} \left[\boldsymbol{\mathsf{A}}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}_{m+1} - \mathbf{b}) + \boldsymbol{\Sigma}_m^{-1} \boldsymbol{\mu}_m \right] \end{split}$$

skąd możemy od razu podać wzór na parametry m-tego rozkładu

$$oldsymbol{\Sigma}_m = \left[oldsymbol{\Sigma}_0^{-1} + m oldsymbol{\mathsf{A}}^{ op} oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} oldsymbol{\mathsf{A}}
ight]^{-1} \ oldsymbol{\mu}_m = oldsymbol{\Sigma}_m \left[oldsymbol{\mathsf{A}}^{ op} oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \left(\sum_{i=1}^m \mathbf{y}_i - m \mathbf{b}
ight) + oldsymbol{\Sigma}_0^{-1} oldsymbol{\mu}_0
ight]$$

Taki sam wynik można by uzyskać rozpatrując łączny rozkład a posteriori dla obserwacji $D=(\mathbf{y}_1,\ldots,\mathbf{y}_m)$ tj.

$$p(\mathbf{x} \mid D) \cong \pi(\mathbf{x}) \prod_{i=1}^{m} p(\mathbf{y}_i \mid \mathbf{x}) \cong$$

$$\exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_0)^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_0) + \sum_{i=1}^{m} (\mathbf{y}_i - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}_i - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) \right] \right\}$$

Regresja liniowa

Załóżmy, iż modelujemy obserwacje postaci (y, \mathbf{x}) gdzie y to skalar zwany zmienną objaśnianą, którego wartość obserwujemy, a \mathbf{x} to wektor zmiennych objaśniających, który kontrolujemy tj. zakładamy, iż wektor \mathbf{x} dla danego pomiaru y znamy dokładnie. Dodatkowo zakładamy, iż y zależy liniowo od \mathbf{x} tj.

$$y = \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x} + \epsilon \,,$$

gdzie $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ dla znanego σ jest tzw. błędem losowym, a **w** jest estymowanym przez nas parametrem. Możemy zatem zapisać

$$y \mid \mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}, \sigma^2)$$
.

Powiedzmy, iż zaobserwowaliśmy ciąg obserwacji $D = (y_1, \ldots, y_m)$ dla zadanych (lub dokładnie znanych) przez nas $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m)$. Wiarygodność ma zatem postać

$$p(D \mid \mathbf{w}) \cong \prod_{i=1}^{m} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left(y_i - \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}_i \right)^2 \right\}.$$

W przypadku regresji liniowej zamiast pełnego wnioskowania Bayesowskiego o parametrze ${\bf w}$ często stosuje się prostsze podejście polegające na znalezieniu estymaty punktowej MLE. Zanegowana logarytmiczna funkcja wiarygodności ma postać

$$\ell(D \mid \mathbf{w}) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{m} (y_i - \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}_i)^2 + \text{const.}$$

Człon stały możemy oczywiście pominąć i zapisać

$$\ell(D \mid \mathbf{w}) \cong \sum_{i=1}^{m} (y_i - \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}_i)^2 = (\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w})^{\top} (\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w}),$$

gdzie

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^{\top} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^{\top} \end{bmatrix}.$$

Ponieważ otrzymana funkcja ℓ ma postać formy kwadratowej, więc problem optymalizacyjny polegający na znalezieniu minimum ℓ nazywa się metodą najmniejszych kwadratów (z ang. OLS – $Ordinary\ Least\ Squares$). Aby wyznaczyć estymatę $\mathbf{w}_{\mathrm{MLE}}$ musimy rozwiązać równanie

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \left[\mathbf{y}^{\top} \mathbf{y} + \mathbf{w}^{\top} \mathbf{X}^{\top} \mathbf{X} \mathbf{w} - 2 \mathbf{y}^{\top} \mathbf{X} \mathbf{w} \right] = \mathbf{0},$$

skad

$$2\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X}\mathbf{w} - 2\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y} = \mathbf{0}\,,$$

zatem

$$\mathbf{w}_{\mathrm{MLE}} = (\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y}$$
 .

Pełniejszą informację o parametrze w możemy uzyskać rozpatrując rozkład a posteriori $p(\mathbf{w}\mid D)$. Jeśli jako prior przyjmiemy rozkład normalny z pewnymi parametrami $\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0$ to zauważmy, iż otrzymujemy instancję liniowego modelu Gaussowskiego

$$\mathbf{y} \mid \mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{X}\mathbf{w}, \sigma^2 \mathbf{1})$$

 $\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0)$

skąd rozkład a posteriori jest rozkładem normalnym

$$\mathbf{w} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_m, \boldsymbol{\Sigma}_m)$$

o parametrach

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Sigma}_m = \left[\boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} + \sigma^{-2} \boldsymbol{\mathsf{X}}^\top \boldsymbol{\mathsf{X}} \right]^{-1} \\ & \boldsymbol{\mu}_m = \boldsymbol{\Sigma}_m \left[\sigma^{-2} \boldsymbol{\mathsf{X}}^\top \mathbf{y} + \boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} \boldsymbol{\mu}_0 \right] \end{split}$$

W powyższych wzorach nazwy parametrów nie są przykładowe: po zaobserwowaniu 0 przykładów rozkład parametru \mathbf{w} jest rozkładem a priori $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0)$; po zaobserwowaniu po jednej wartości y_i w m zadanych (znanych dokładnie) punktach \mathbf{x}_i otrzymujemy rozkład a posteriori $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_m, \boldsymbol{\Sigma}_m)$. Gdybyśmy w każdym z m punktów \mathbf{x}_i dokonywali pomiaru y_i s–krotnie to wtedy wykorzystując wzory wyprowadzone przy iteracyjnym stosowaniu wnioskowania w liniowym modelu Gaussowskim otrzymujemy rozkład normalny o parametrach

$$\begin{split} & \pmb{\Sigma}_{m;s} = \left[\pmb{\Sigma}_0^{-1} + \frac{s}{\sigma^2} \pmb{\mathsf{X}}^\top \pmb{\mathsf{X}} \right]^{-1} \\ & \pmb{\mu}_{m;s} = \pmb{\Sigma}_{m;s} \left[\sigma^{-2} \pmb{\mathsf{X}}^\top \sum_{i=1}^s \mathbf{y}_i + \pmb{\Sigma}_0^{-1} \pmb{\mu}_0 \right] \end{split} .$$

Rozkład predykcyjny dla nowej obserwacji y poczynionej w punkcie ${\bf x}$ jest dany przez

$$p(y \mid \mathbf{y}) = \int_{\mathbb{R}^n} p(y \mid \mathbf{w}) p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) d^n \mathbf{w}.$$

Nietrudno zauważyć, iż będzie to rozkład normalny o parametrach

$$\mu_{y|\mathbf{y}} = \mathbb{E}[y \mid \mathbf{y}] = \int_{\mathbb{R}} yp(y \mid \mathbf{y}) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \int_{\mathbb{R}} dy \, yp(y \mid \mathbf{w})$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n} d^n \mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \mathbf{x}^\top \mathbf{w} = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\mu}_m \, .$$

oraz

$$\sigma_{y|\mathbf{y}}^{2} = \mathbb{E}\left[(y - \mu_{y|\mathbf{y}})^{2} \mid \mathbf{y} \right] = \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \int_{\mathbb{R}} dy \, (y - \mu_{y|\mathbf{y}})^{2} p(y \mid \mathbf{w})$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \int_{\mathbb{R}} dy \, \left(y^{2} + \mu_{y|\mathbf{y}}^{2} - 2\mu_{y|\mathbf{y}} y \right) p(y \mid \mathbf{w})$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \left(\sigma^{2} + (\mathbf{x}^{\top}\mathbf{w})^{2} + \mu_{y|\mathbf{y}}^{2} - 2\mu_{y|\mathbf{y}} \mathbf{x}^{\top} \mathbf{w} \right)$$

$$= \sigma^{2} + \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \left(\mathbf{x}^{\top}\mathbf{w} - \mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\mu}_{m} \right)^{2}$$

$$= \sigma^{2} + \mathbf{x}^{\top} \mathbb{E}[(\mathbf{w} - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{w}})(\mathbf{w} - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{w}})^{\top} \mid \mathbf{y}|\mathbf{x} = \sigma^{2} + \mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_{m} \mathbf{x}.$$

Powyżej skorzystaliśmy ze znanego faktu, iż dla jednowymiarowej zmiennej losowej zachodzi $\sigma^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu_X^2$, skąd $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2 + \mu_X^2$. Podsumowując rozkład predykcyjny ma postać

$$y \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\mu}_m, \sigma^2 + \mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_m \mathbf{x}) \,.$$

Regularyzacja

Regularyzacją nazywamy proces polegający na wprowadzeniu ad hoc do zagadnienia optymalizacji dodatkowych członów tak, aby rozwiązanie było "regularne" (prostsze, nieosobliwe, jednoznaczne ...). W przypadku funkcji kosztu ℓ najczęściej dodajemy człon penalizujący rozwiązania o dużej normie estymowanego parametru postaci

$$\gamma \|\theta\|$$

dla pewnej normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametru γ określającego siłę regularyzacji. W kontekście Bayesowskim regularyzację można również rozumieć jako pewną niechęć ("tłumienie", zachowawczość) modelu do zmiany rozkładu a priori estymowanego parametru po pojawieniu się kolejnych obserwacji.

Przykładowo jeśli w zagadnieniu Bayesowskiej regresji liniowej jako prior przyjmiemy rozkład normalny

$$\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \tau^2 \mathbf{1})$$

to rozkład a posteriori jest rozkładem normalnym o parametrach

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Sigma}_m = \sigma^2 \left[\gamma \mathbf{1} + \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \right]^{-1} \\ & \boldsymbol{\mu}_m = \left[\gamma \mathbf{1} + \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \right]^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \end{split} ,$$

gdzie $\gamma = \sigma^2/\tau^2$ jest hiper-parametrem określającym siłę regularyzacji. Zauważmy, że im większa jest wartość γ (mniejsza niepewność związana z rozkładem a priori) tym drugi człon w nawiasie staje się mniej istotny. Taki sam wynik możemy uzyskać metodą OLS jeśli do funkcji kosztu dodamy człon regularyzujący dla zwykłej normy euklidesowej. Zagadnienie minimalizacji funkcji kosztu będącej formą kwadratową z dodanym członem regularyzującym nazywamy również regresją grzbietową.

Procesy Gaussowskie

Jak już wspomnieliśmy macierz kowariancji n-wymiarowej zmiennej losowej ${\bf x}$ o wartości oczekiwanej ${\boldsymbol \mu}$ jest zdefiniowana jako

$$\mathbf{\Sigma} = \mathbb{E}\left[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^{\top} \right] .$$

Pokazaliśmy również, iż macierz ta jest nieujemnie określona. Dodatkowo pokażemy, iż dla każdej nieujemnie określonej macierzy symetrycznej \mathbf{K} wymiaru $n \times n$ istnieje n—wymiarowa zmienna losowa o wielowymiarowym rozkładzie normalnym dla której \mathbf{K} jest macierzą kowariancji. Istotnie dla każdej nieujemnie określonej macierzy symetrycznej istnieje macierz \mathbf{L} taka, że

$$K = LL^{\top}$$

jest to tzw. dekompozycja Choleskiego. Niech $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})$, wówczas zmienna losowa $\mathbf{L}\mathbf{z}$ ma rozkład o zerowej wartości oczekiwanej i macierzy kowariancji

$$\mathbb{E}\left[(\boldsymbol{L}\mathbf{z})(\boldsymbol{L}\mathbf{z})^\top \right] = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{L}\mathbf{z}\mathbf{z}^\top \boldsymbol{L}^\top \right] = \boldsymbol{L}\mathbb{E}[\mathbf{z}\mathbf{z}^\top]\boldsymbol{L}^\top = \boldsymbol{L}\boldsymbol{1}\boldsymbol{L}^\top = \boldsymbol{K}\,.$$

Powyższe własności wskazują, iż macierze kowariancji można w pewnym sensie utożsamiać z nieujemnie określonymi macierzami symetrycznymi.

Zdefiniujemy teraz funkcję kowariancji $k:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}$ taką, że $\forall m\in\mathbb{N}:$ $\forall X=\{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_m\}\subset\mathbb{R}^n$ macierz

$$k(X,X) = \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_m) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_m) \end{bmatrix}$$

jest dodatnio określoną macierzą symetryczną. Funkcję k nazywamy również jądrem dodatnio określonym (z ang. positive definite kernel) lub jądrem Mercera.

Dla dwóch zbiorów punktów $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\} \subset \mathbb{R}^n$ i $Y = \{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s\} \subset \mathbb{R}^n$ i funkcji kowariancji k wprowadzimy oznaczenie

$$k(X,Y) := \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_s) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_1) & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_s) \end{bmatrix}.$$

Poniżej podajemy kilka przykładów funkcji kowariancji

• Gaussian kernel dla normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametru l

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \exp\left\{-\frac{1}{2l^2} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2\right\}$$

• Periodic kernel dla normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametrów l,p

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \exp\left\{-\frac{2}{l^2}\sin^2\left(\frac{\pi}{p}\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|\right)\right\}$$

• White noise kernel dla hiper-parametru σ

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sigma^2 \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{y}}$$

• Matérn kernel dla normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametrów l, ν

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \left(\frac{\sqrt{2\nu}}{l} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right)^{\nu} K_{\nu} \left(\frac{\sqrt{2\nu}}{l} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right) ,$$

gdzie $\Gamma(x)$ to funkcja gamma Eulera, a $K_{\nu}(x)$ to zmodyfikowana funkcja Bessela 2-go rodzaju rzędu ν .

Dodatkowo suma lub iloczyn dwóch funkcji kowariancji oraz złożenie funkcji kowariancji z wielomianem o nieujemnych współczynnikach jest również funkcją kowariancji.

Procesem Gaussowskim (z ang. Gaussian Process) nazywamy rodzinę skalarnych zmiennych losowych indeksowanych przez punkty $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\mathcal{GP} = \{ f_{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \}$$

taką że każdy skończony podzbiór \mathcal{GP} ma łącznie wielowymiarowy rozkład normalny tj. dla dowolnego zbioru $X=\{\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m\}\subset\mathbb{R}^n$ zachodzi

$$\begin{bmatrix} f_{\mathbf{x}_1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}_m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_X, \boldsymbol{\Sigma}_X) \,.$$

Zauważmy, iż process Gaussowski możemy jednoznacznie zdefiniować podając "przepisy" na parametry μ_X i Σ_X dla dowolnego zbioru X. W praktyce często przyjmujemy $\mu_X = \mathbf{0}$, natomiast przepisem na macierz kowariancji może być zdefiniowana wyżej funkcja kowariancji k(X,X) tj.

$$\begin{bmatrix} f_{\mathbf{x}_1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}_m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, k(X, X)).$$

Process Gaussowski daje nam w praktyce rozkład prawdopodobieństwa nad funkcjami $f:\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}$, których charakter jest określony przez jądro k (np. funkcja gładka dla jądra Gaussowskiego, okresowa dla jądra periodycznego, itp.). Zauważmy, że nie wnioskujemy tu o parametrach konkretnej rodziny funkcji (jak w przypadku regresji liniowej); interesuje nas jedynie rozkład predykcyjny. Załóżmy, iż w zadanych (lub dokładnie znanych) przez nas punktach $X=\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\ldots,\mathbf{x}_m\}$ zaobserwowaliśmy wartości pewnej funkcji, o których zakładamy, iż pochodzą z procesu Gaussowskiego zadanego jądrem k, które wyraża nasze założenia a priori co do charakteru badanej funkcji

$$\mathbf{f}_X = egin{bmatrix} f_{\mathbf{x}_1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}_m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, k(X, X)) \, .$$

Powiedzmy, iż chcemy znać wartości \mathbf{f}_Y tej funkcji w zadanych punktach $Y = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_s\}$. Ponieważ założyliśmy, iż wartości funkcji pochodzą z procesu Gaussowskiego, więc rozkład łączny \mathbf{f}_X i \mathbf{f}_Y jest rozkładem normalnym

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_X \\ \mathbf{f}_Y \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} k(X,X) & k(X,Y) \\ k(Y,X) & k(Y,Y) \end{bmatrix} \right) \,.$$

Zauważmy, iż jest to instancja modelu Gaussowskiego, więc rozkład warunkowy $\mathbf{f}_Y \mid \mathbf{f}_X$ jest również rozkładem normalnym o parametrach

Dodatkową niepewność związaną z pomiarem wartości \mathbf{f}_X możemy uchwycić zmieniając postać jądra

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leftarrow k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathcal{I}_X(\mathbf{x}) \sigma^2 \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{y}},$$

gdzie σ jest hiper-parametrem określającym precyzję pomiaru. Oczywiście k jest dalej funkcją kowariancji, gdyż takie podstawienie powoduje jedynie dodanie dodatnich członów do pewnych elementów diagonalnych macierzy kowariancji, więc macierz ta jest nadal symetryczna i dodatnio określona. Wówczas rozkład predykcyjny ma parametry

$$\boldsymbol{\mu} = k(Y, X) \left[k(X, X) + \sigma^2 \mathbf{1} \right]^{-1} \mathbf{f}_X$$
$$\boldsymbol{\Sigma} = k(Y, Y) - k(Y, X) \left[k(X, X) + \sigma^2 \mathbf{1} \right]^{-1} k(X, Y)$$

Wieloklasowa regresja logistyczna

Załóżmy, iż modelujemy obserwacje postaci (t, \mathbf{x}) , gdzie $t \in \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s\}$ to etykieta określająca przynależność do jednej z s klas, a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ jest znanym (lub zadanym) przez nas dokładnie wektorem cech obiektu dla których zaobserwowaną klasą jest t. Zakładamy ponadto, iż prawdopodobieństwo przynależności do klasy τ_j (jednej z s klas) dla wektora cech \mathbf{x} ma postać tzw. funkcji softmax

$$\pi_j(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z(\mathbf{x})} e^{\mathbf{w}_j^{\top} \mathbf{x}},$$

gdzie \mathbf{w}_j są estymowanymi przez nas parametrami. Ze względu na warunek unormowania musimy mieć

$$\sum_{j=1}^{s} \pi_j = 1,$$

skąd stała normalizacyjna $Z(\mathbf{x})$ ma postać

$$Z(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{s} e^{\mathbf{w}_{j}^{\top} \mathbf{x}}$$
.

Rozkład zmiennej losowej t jest w takim razie dyskretnym rozkładem wielopunktowym (z ang. $categorical\ distribution$) postaci

$$t \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s \sim \operatorname{Cat}(\pi_1(\mathbf{x}), \dots, \pi_s(\mathbf{x}))$$
.

Zauważmy, iż prawdopodobieństwo wylosowania etykiety tdla parametrów \mathbf{w}_j możemy zapisać jako

$$p(t \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = \prod_{j=1}^s \pi_j(\mathbf{x})^{\delta(t, \tau_j)}.$$

Powiedzmy, że mamy obserwacje $D=(t_1,\ldots,t_m)$ dla znanych (lub zadanych) przez nas dokładnie wektorów cech $(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_m)$. Funkcja wiarygodności ma wówczas postać

$$p(D \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = \prod_{i=1}^m p(t_i \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^s \pi_j(\mathbf{x}_i)^{\delta(t_i, \tau_j)}.$$

Jako prior dla parametrów \mathbf{w}_j przyjmiemy rozkład normalny z pewnym hiperparametrem γ

$$\forall j \in \{1,\ldots,s\} : \mathbf{w}_j \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \gamma^{-1}\mathbf{1}).$$

W przypadku regresji logistycznej ograniczymy się do znalezienia estymaty MAP parametrów \mathbf{w}_j tak, aby w przyszłości do nowego wektora cech \mathbf{x} przyporządkować klasę o największym prawdopodobieństwie $\pi_j(\mathbf{x})$. Znalezienie estymaty

MAP sprowadza się do znalezienia minimum zregularyzowanej funkcji kosztu

$$\ell^*(D \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = -\log[p(D \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s)\pi(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s)]$$

$$= -\log\left[\prod_{k=1}^s e^{-\frac{\gamma}{2}\mathbf{w}_k^{\top}\mathbf{w}_k} \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^s \pi_j(\mathbf{x}_i)^{\delta(t_i, \tau_j)}\right]$$

$$= \frac{\gamma}{2} \sum_{j=1}^s \mathbf{w}_j^{\top}\mathbf{w}_j - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j) \log \pi_j(\mathbf{x}_i).$$

Niestety dla tak zdefiniowanej funkcji kosztu nie można znaleźć wzoru na minimum w postaci analitycznej, dlatego wykorzystamy numeryczny algorytm optymalizacji zwany spadkiem wzdłuż gradientu.

Metoda spadku wzdłuż gradientu

Algorytm spadku wzdłuż gradientu (z ang. gradient descent) dla funkcji $f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m)$ ma postać

- 1. Wybierz parametry początkowe $\mathbf{x}_1^{(0)}, \dots, \mathbf{x}_m^{(0)}$
- 2. Powtarzaj

$$\begin{split} \mathbf{x}_{1}^{(t+1)} &= \mathbf{x}_{1}^{(t)} - \epsilon_{1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_{1}} \bigg|_{\mathbf{x}_{1}^{(t)}, \dots, \mathbf{x}_{m}^{(t)}} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{m}^{(t+1)} &= \mathbf{x}_{m}^{(t)} - \epsilon_{m} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_{m}} \bigg|_{\mathbf{x}^{(t)}, \dots, \mathbf{x}_{m}^{(t)}} \end{split}$$

gdzie $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_m$ to hiper-parametry zwane stałymi uczącymi (z ang. learning rate).

Zakładając $\epsilon_1 = \ldots = \epsilon_m = \epsilon$ i wprowadzając

$$\mathbf{X} := \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^\top \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_1}^\top \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_m}^\top \end{bmatrix}$$

możemy zapisać powyższe równania w kompaktowej formie

$$\mathbf{X}^{(t+1)} = \mathbf{X}^{(t)} - \epsilon \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} \bigg|_{\mathbf{X}^{(t)}}.$$

Aby zminimalizować numerycznie funkcję kosztu ℓ^* stosując metodę spadku wzdłuż gradientu musimy obliczyć pochodne funkcji kosztu po parametrach \mathbf{w}_i

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{w}_k} = \gamma \mathbf{w}_k - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j) \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_k} \log \pi_j(\mathbf{x}_i) ,$$

ale

$$\begin{split} \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_k} \log \pi_j(\mathbf{x}_i) &= \frac{1}{\pi_j(\mathbf{x}_i)} \frac{Z(\mathbf{x}_i) \frac{\partial \mathbf{e}^{\mathbf{x}_i^\top \mathbf{w}_j}}{\partial \mathbf{w}_k} - \mathbf{e}^{\mathbf{x}_i^\top \mathbf{w}_j} \frac{\partial Z(\mathbf{x}_i)}{\partial \mathbf{w}_k}}{Z^2(\mathbf{x}_i)} \\ &= \frac{Z(\mathbf{x}_i)}{\mathbf{e}^{\mathbf{x}_i^\top \mathbf{w}_j}} \frac{Z(\mathbf{x}_i) \mathbf{x}_i \mathbf{e}^{\mathbf{x}_i^\top \mathbf{w}_k} \delta_{jk} - \mathbf{e}^{\mathbf{x}_i^\top \mathbf{w}_j} \mathbf{e}^{\mathbf{x}_i^\top \mathbf{w}_k} \mathbf{x}_i}{Z^2(\mathbf{x}_i)} \\ &= \mathbf{x}_i \delta_{jk} - \mathbf{x}_i \pi_k(\mathbf{x}_i) \end{split}$$

zatem

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{w}_k} = \gamma \mathbf{w}_k - \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j) \delta_{jk} + \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \pi_k(\mathbf{x}_i) \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j).$$

Zauważmy jednak, iż

$$\sum_{j=1}^{s} \delta(t_i, \tau_j) = 1, \quad \sum_{j=1}^{s} \delta(t_i, \tau_j) \delta_{jk} = \delta(t_i, \tau_k),$$

zatem ostatecznie

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{w}_k} = \gamma \mathbf{w}_k + \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \left[\pi_k(\mathbf{x}_i) - \delta(t_i, \tau_k) \right].$$

Wprowadzając macierze

$$\begin{split} \mathbf{X} &= \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^\top \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{w}_s^\top \end{bmatrix}, \\ \mathbf{S} &= \begin{bmatrix} \pi_1(\mathbf{x}_1) & \cdots & \pi_s(\mathbf{x}_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi_1(\mathbf{x}_m) & \cdots & \pi_s(\mathbf{x}_m) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \delta(t_1, \tau_1) & \cdots & \delta(t_1, \tau_s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta(t_m, \tau_1) & \cdots & \delta(t_m, \tau_s) \end{bmatrix} \end{split}$$

możemy w takim razie zapisać zdefiniowaną wyżej macierz pochodnych wymaganych do algorytmu spadku wzdłuż gradient w kompaktowej formie jako

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{W}} = (\mathbf{S} - \mathbf{T})^\top \mathbf{X} \,.$$

Zauważmy, iż zregularyzowana funkcja kosztu rośnie wraz ze wzrostem liczby obserwacji m. Wynika z tego, iż stała ucząca musi być zależna od liczby przykładów. Możemy na przykład stwierdzić, iż $\epsilon \leftarrow m^{-1}\epsilon$ i wówczas minimalizujemy tak naprawdę średni koszt ℓ^*/m .

Wnioskowanie metodami Monte Carlo

Całe wnioskowanie Bayesowskie opiera się na wyznaczaniu rozkładów a posteriori, które wyrażają naszą wiedze o estymowanym parametrze. Do tej pory rozważaliśmy modele Bayesowskie dla których prior i wiarygodność były dane przez rozkłady normalne. Dzięki temu mogliśmy wyprowadzić analityczne wzory na parametry rozkładu a posteriori, który również był rozkładem normalnym. Dla wielu interesujących modeli nie jesteśmy jednak w stanie tego zrobić (np. w zagadnieniu regresji logistycznej ograniczyliśmy się jedynie do estymaty punktowej), gdyż obliczenie stałej normalizującej dla rozkładu $p(\theta \mid D)$ może wymagać obliczenia całki, której nie jesteśmy w stanie wyrazić w sposób jawny lub sumy po wykładniczo wielu elementach. Wnioskowanie Bayesowskie można jednak prowadzić w modelach, w których nie dysponujemy jawnym wzorem na gestość prawdopodobieństwa rozkładu a posteriori. Okazuje się, iż do generowania próbek z rozkładu $p(\theta \mid D)$ wystarcza znajomość tego rozkładu z dokładnością do stałej normalizującej, a zatem wystarczy znać rozkład łączny $p(\theta, D) = p(D \mid \theta)\pi(\theta)$. Generowanie próbek z kolei wystarcza natomiast, na mocy silnego prawa wielkich liczb, do szacowania wartości średnich dowolnych funkcji estymowanego parametru θ . Przypomnijmy, iż na mocy silnego prawa wielkich liczb ciąg średnich częściowych (\overline{X}_n) ciągu zmiennych losowych (X_n) i.i.d. z rozkładu $X \sim \mathcal{D}$ jest zbieżny z prawdopodobieństwem 1 do wartości oczekiwanej $\mathbb{E}[X]$ tj.

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\overline{X}_n=\mathbb{E}[X]\right)=1$$
.

Wartość oczekiwaną $\mathbb{E}[X]$ możemy zatem przybliżyć średnią \overline{X}_n z dużej ilości próbek.

Wnioskowanie Monte Carlo pozwala nam szacować różne wielkości w tzw. hierarchicznych modelach Bayesowskich (z ang. *Bayesian hierarchical modeling*). Rozważmy jeszcze raz przykład regresji liniowej w ujęciu Bayesowskim, ale rozważmy teraz model postaci

$$\begin{split} \sigma^2 &\sim \mathcal{D}(\lambda) \\ \mathbf{w} &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0) \\ y \mid \mathbf{w}, \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}, \sigma^2) \end{split} ,$$

gdzie λ, μ_0, Σ_0 są pewnymi hiper-parametrami. Dla takiego modelu nie możemy w ogólności znaleźć jawnej postaci rozkładu a posteriori. Jeśli jednak umiemy generować próbki z rozkładu łącznego

$$Z \cdot p(\mathbf{w}, \sigma^2 \mid D) = p(D, \mathbf{w}, \sigma^2) = p(D \mid \mathbf{w}, \sigma^2) \pi(\mathbf{w}) \pi(\sigma^2)$$

to wszystkie interesujące wielkości możemy oszacować jako odpowiednie średnie.

Algorytm Importance Sampling (IS)

Załóżmy, iż chcemy obliczyć wartość oczekiwaną pewnej funkcji zmiennej losowej \mathbf{x} względem skomplikowanego rozkładu prawdopodobieństwa $p(\mathbf{x})$, który znamy

jedynie z dokładnością do stałej normalizującej

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z_p} \tilde{p}(\mathbf{x})$$

tj. szukamy

$$\mathbb{E}_p[f(\mathbf{x})] = \int f(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}.$$

Jeśli umiemy generować próbki \mathbf{x} z innego rozkładu $q(\mathbf{x})$, który nazywamy rozkładem proponującym kandydatów (z ang. proposal distribution) to możemy zapisać

$$\mathbb{E}_{p}[f(\mathbf{x})] = \int_{\mathbb{R}^{n}} f(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d^{n} \mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^{n}} f(\mathbf{x}) \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} q(\mathbf{x}) d^{n} \mathbf{x}$$
$$= \mathbb{E}_{q} \left[f(\mathbf{x}) \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} \right] = \frac{Z_{q}}{Z_{p}} \mathbb{E}_{q} \left[f(\mathbf{x}) \frac{\tilde{p}(\mathbf{x})}{\tilde{q}(\mathbf{x})} \right].$$

Stosunek stałych Z_p/Z_q również możemy oszacować z próbek z q, gdyż mamy

$$Z_p = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{p}(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x} = Z_q \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\tilde{p}(\mathbf{x})}{\tilde{q}(\mathbf{x})} q(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x} = Z_q \mathbb{E}_q \left[\frac{\tilde{p}(\mathbf{x})}{\tilde{q}(\mathbf{x})} \right],$$

skąd ostatecznie

$$\mathbb{E}_p[f(\mathbf{x})] = \frac{\mathbb{E}_q\left[f(\mathbf{x})\frac{\tilde{p}(\mathbf{x})}{\tilde{q}(\mathbf{x})}\right]}{\mathbb{E}_q\left[\frac{\tilde{p}(\mathbf{x})}{\tilde{q}(\mathbf{x})}\right]}.$$

Jeśli z rozkładu q wygenerowaliśmy próbki $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ to na mocy silnego prawa wielkich liczb mamy

$$\mathbb{E}_p[f(\mathbf{x})] \approx \frac{\sum_{i=1}^m f(\mathbf{x}_i) \frac{\tilde{p}(\mathbf{x}_i)}{\tilde{q}(\mathbf{x}_i)}}{\sum_{i=1}^m \frac{\tilde{p}(\mathbf{x}_i)}{\tilde{q}(\mathbf{x}_i)}} = \sum_{i=1}^m \lambda_i f(\mathbf{x}_i),$$

gdzie

$$\lambda_i = \frac{\tilde{p}(\mathbf{x}_i)/\tilde{q}(\mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^m \tilde{p}(\mathbf{x}_j)/\tilde{q}(\mathbf{x}_j)}.$$

Algorytm Importance Sampling jest prostym algorytmem Monte Carlo, który ma jeden zasadniczy problem. W jaki sposób mamy wybrać rozkład proponujący kandydatów q? Pewną odpowiedź na to pytanie sugeruje analiza wariancji statystyki

$$\overline{f}_m(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{f(\mathbf{x}_i) p(\mathbf{x}_i)}{q(\mathbf{x}_i)}$$

dla $\mathbf{x}_i \sim q$ i zakładając dla uproszczenia, iż f jest funkcją skalarną mamy

$$\operatorname{Var}[\overline{f}_m] = \frac{1}{m} \operatorname{Var}_q \left[f(\mathbf{x}) \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} \right] = \frac{1}{m} \int_{\mathbb{D}^n} \frac{(f(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) - \mu_f q(\mathbf{x}))^2}{q(\mathbf{x})} \, \mathrm{d}^n \mathbf{x} \ .$$

Chcemy oczywiście, aby wariancja była jak najmniejsza, gdyż wówczas mała liczba próbek da dobre przybliżenie wartości oczekiwanej. Rozkład proponujący kandydatów powinien być zatem proporcjonalny do $f(\mathbf{x})p(\mathbf{x})$, co może być trudne do praktycznego zrealizowania.

Markov Chain Monte Carlo (MCMC)